

# 光学吸收测量仪

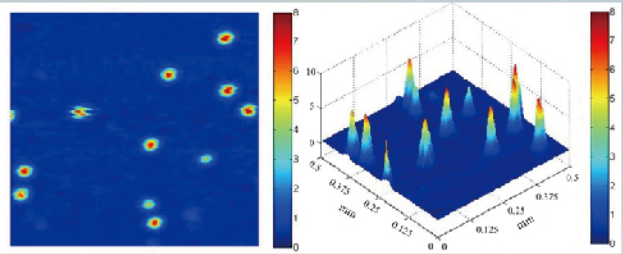
## + 产品介绍

光学薄膜吸收测量仪 (Model PTS-2000), 适用于各类光学薄膜和光学元器件表面吸收率的检测和分析。根据客户具体需求, 可进行紫外、可见或者近红外波段的精密测量。

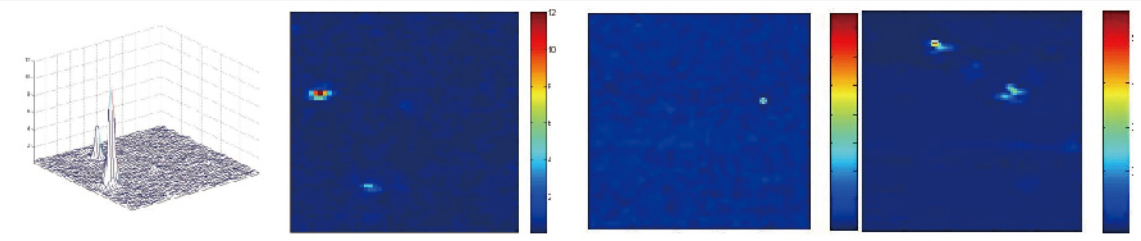
光学材料体内吸收测量仪 (Model PTB-2000), 适用于各类光学元器件及材料体内吸收率的检测和分析。根据客户具体需求, 可进行紫外、可见或者近红外波段的精密测量。

## + 特点

- ※ 高灵敏度
- ※ 高重复精度
- ※ 一键式操作
- ※ 样品更换便捷、无需重复校准
- ※ 可进行吸收率的横向均匀性分析
- ※ 可进行激光辐照或环境变化条件下的吸收率稳定性分析
- ※ 泵浦光源: 可以标配, 也可根据用户需求选配或者由客户自配



光学薄膜缺陷检测 ( 1064 nm)



光学薄膜吸收均匀性测量结果 (532 nm)

| 光学吸收测量仪 |                              |                              |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 产品类别    | 光学薄膜吸收测量仪                    | 光学材料体内吸收测量仪                  |
| 型号      | PTS-2000                     | PTB-2000                     |
| 检测灵敏度   | 10 ppb                       | 10 ppb                       |
| 检测波长    | 355 nm, 532 nm, 1064 nm或定制波长 | 355 nm, 532 nm, 1064 nm或定制波长 |
| 泵浦激光    | 根据客户需求配置                     | 根据客户需求配置                     |
| 横向空间分辨率 | ≤ 10 μm                      | ≤ 10 μm                      |
| 样品尺寸    | 50mm×50mm × 10mm             | 50mm×50mm × 10mm             |

注: 可以根据客户需求提供同类特制仪器和相关测试的解决方案。